CEI 60749-8 (Première édition – 2002)

IEC 60749-8 (First edition – 2002)

Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods –

Partie 8: Etanchéité

Part 8: Sealing

CORRIGENDUM 1

Page 28

9.4 Critères de défaillance

Première phrase

Au lieu de:

Un dispositif doit être rejeté s'il gagne 1,0 mg au moins et s'il a un volume interne ≥0,01 cm³ et 2,0 mg au moins si le volume est >0.01 cm³.

lire:

Un dispositif doit être rejeté s'il gagne 1,0 mg au moins et s'il a un volume interne ≤0,01 cm³ et 2,0 mg au moins si le volume est >0.01 cm³.

Page 29

9.4 Failure criteria

First sentence

Instead of:

A device shall be rejected if it gains 1,0 mg or more and has an internal volume of $\ge 0,01 \text{ cm}^3$ and 2,0 mg or more if the volume is $> 0,01 \text{ cm}^3$.

read:

A device shall be rejected if it gains 1,0 mg or more and has an internal volume of $\le 0,01 \text{ cm}^3$ and 2,0 mg or more if the volume is $>0,01 \text{ cm}^3$.

CE CORRIGENDUM EST AUSSI VALABLE POUR:

CEI 60749

Dispositifs à semiconducteurs – Essais mécaniques et climatiques Amendement 2 (2001), page 60 et Edition 2.2 (2002), page 132, sous 5.7.4 Critères de défaillance

THIS CORRIGENDUM IS ALSO VALID FOR:

IEC 60749

Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods Amendment 2 (2001), page 61 and Edition 2.2 (2002), page 133, under 5.7.4 Failure criteria

Avril 2003 April 2003